

电子设计创新大会 (EDI CON China 2017) 议程表

2017年4月25日, 星期二

08:00-17:00	注册、报到				
	会议室305A	会议室305B	会议室307A	会议室307B	会议室302A
	赞助商研习会				
09:20-10:00	WS_TU101: 三安集成的砷化镓和氮化镓量产技术(158) 厦门三安集成电路有限公司	WS_TU102: 5G应用中PTFE多层板的选材和加工(161) Taconic	WS_TU103: 铺好通往5G之路(147) National Instruments	WS_TU104: 适用于太赫兹应用领域的全球领先III/V MMIC工艺路线图(163) OMMIC/四川益丰电子	
10:00-10:20	茶歇(展厅)				
10:30-12:00	全体会议(会议室302) 主旨演讲: Peter Rabbeni, GLOBALFOUNDRIES; 特邀演讲: Satish Dhanasekaran, Keysight Technologies; Corbett Rowell, Rohde & Schwarz; Jason White, National Instruments				
12:00-13:00	午餐(展厅)				
	技术报告会				
	5G	测试与测量	雷达/通信	放大器	射频与微波
13:00-13:20	TU_101: 5G移动通信中的极化码研究(24) Shi Xiaofeng, Rohde & Schwarz	TU_102: 材料介电常数和磁导率的先进测量技巧(5) Ryoji Takizawa, Keysight	TU_103: L波段雷达应用的900W GaN-HEMT晶体管(23) Weishu Zhou, Microsemi	TU_104: 用于LTE-A的高线性CMOS功率放大器和追踪器(4) Florinel Balteanu, Skyworks	TU_105: 1个10瓦氮化镓功率晶体管的带谐波阻抗控制的任意负载阻抗下的X参数提取的经验之谈(68) Di Liu, Keysight
13:25-13:45	TU_201: 针对5G毫米波设备测试的超宽带信号幅相校正方法(35) Li Feng, Keysight	TU_202: 实时频谱监测面面观(88) Fangze Tu, National Instruments	TU_203: 可扫描相控阵收发前端模块之电磁与电路协同仿真(44) Milton Lien, AWR	TU_204: 一种新型基于阻抗补偿技术的3.4-3.8GHz宽带Doherty功率放大器(82) Rui Ma, Mitsubishi Electric Research Labs	TU_205: 平面电阻在5G功分器和高速互联中的应用(19) Helena Li, Shanghai Gentronics Electronics. Ltd.
13:50-14:10	TU_301: MIMO OTA多探头测试方案(71) Andy Zhang, hwa-tech Information System company	TU_302: 查找设计中的串扰问题的新方法(40) Min-Jie Chong, Keysight	TU_303: 雷达和接收机测试用RF环境的生成(99) Steffen Heuel, Rohde & Schwarz	TU_304: 一种应用于基站的硅基氮化镓三路Doherty功率放大器设计(116) xin liu, MACOM	TU_305: 固态射频能量: 2017年终将取得大量突破, 不是吗? Klaus Werner RF Energy Alliance 演讲和专家座谈会
14:15-14:35	TU_401: 射频绝缘体上硅技术保障可靠的5G波束赋形(92) Charles Gui, Peregrine Semiconductor	TU_402: 手机前端模块的最新发展趋势以及噪声系数测试(51) Gu HongLiang, Keysight	TU_403: 汽车雷达干扰测试(100) Steffen Heuel, Rohde & Schwarz	TU_404: 固态功放的新前沿: 空间合成功放(60) Maurizio D'Antoni, University of Rome	
14:40-15:00	TU_501: 5G终端设计验证及测试挑战(28) Li Xin, Keysight	TU_502: 一种构建射频放大器/前端模块(RF PA/FEM)测试系统的新方法(31) Jianhui Wang, Keysight	TU_503: 使用先进的行为模型和仿真/测量的辐射元件为大型相控阵天线系统建模(43) AWR	TU_504: 内置0.5μm GaAs E-pHEMT线性器的MMIC E类自适应偏置功率放大器的设计(111) SHANTHI.P, R.V.COLLEGE OF ENGINEERING	
15:00-15:20	茶歇(展厅)				
	赞助商研习会				
	测量与建模	5G	高速数字设计	半导体	测试与测量
15:20-16:00	WS_TU201: 从基于矢量波形测试的负载牵引到非线性行为级模型(11) Focus Microwaves	WS_TU202: Verizon 5G和3GPP新空口的信号产生和分析(102) Rohde & Schwarz	WS_TU203: PCIE高速通道中的过孔设计优化(53) ANSYS	WS_TU204: E-Foundry为客户带来全新服务体验(133) 成都海威华芯	WS_TU205: 新型高性能测试电缆组件、毫米波集束电缆组件和航空用高速数据电缆组件(138) Mitron
16:05-16:45	WS_TU301: 负载牵引: 模型提取、验证和设计的关键工具(48) Maury Microwave	WS_TU302: 基于软件定义无线电技术的便携式MIMO测试平台(128) Sample Technology Shanghai	WS_TU303: 使用串行和并行接口连接FPGA和高速数据转换器(108) e2V	WS_TU304: 三安集成三五族半导体代工服务(159) 厦门三安集成电路	WS_TU305: 大规模MIMO原型和MIMO OTA测试(136) Keysight
16:50-17:30	WS_TU401: 通过创新的建模方法缩短关键RF FEM电路模块的设计周期(81) Global Foundries	PN_TU402: 座谈会: 哪项技术更适合初期的5G系统: 低于6GHz的大规模MIMO还是毫米波? (130) Moderator: Hindle	WS_TU403: 高速仿真和测量(137) CST	WS_TU404: 能讯氮化镓功放技术和产品(146) 苏州能讯半导体	WS_TU405: 拓展二端口网络分析仪应用的开关矩阵多端口自动化测试系统(141) MiniCircuits
18:00	欢迎晚宴(需持代表证和门票)				

展览
开放
10:00
至
17:30

2017年4月26日, 星期三

08:00-17:00	注册、报到				
	会议室305A	会议室305B	会议室307A	会议室307B	会议室302A
	技术报告会				
	测试与测量	系统设计	物联网	5G	射频与微波
09:00-09:20	WE_101: 将微波频率仪器扩展应用到毫米波测量的技术(78) Wei Lin, National Instruments	WE_102: 解决5G的多信道、宽带测试和数据管理问题(25) Sheri DeTomasi, Keysight	WE_103: 智能手表的电磁和结构联合设计(91) Cier Siang Chua, CST	WE_104: 用于未来联网设备的新无线技术(55) David Hall, National Instruments	WE_105: 射频和微波器件中杂散搜索的先进技术(6) Martin Schmaehling, Rohde & Schwarz
09:25-09:45	WE_201: 低功率广域网在物联网应用中的挑战及测试解决方案(30) Jian Li, Keysight	WE_202: 构建一个多GHz实时射频流系统(98) Shivansh Chaudhary, National Instruments	WE_203: 用于射频识别(RFID)测试的信道模拟(112) Hui Shao, JX Instrumentation Co Ltd	WE_204: 具有波束赋形网络的紧凑型相控阵, 用于基于液晶聚合物基板的60GHz 5G MIMO系统(3) Wu Jiarui, Keysight	WE_205: 具有相位检测器本底噪声退化的多偏移PLL合成器(29) Dr. Alexander Chenakin, Micro Lambda Wireless, Inc.
09:45-10:05	茶歇(展厅)				
	高速数字设计	测试与测量	EMC/EMI	5G	射频与微波
10:10-10:30	WE_301: PCB设计误区之时序设计(9) Wu Jun, Edadoc	WE_302: 一种用于终端性能测试的搭载于OTA暗室的外场无线环境建模方法(74) Huaizhi Yang, Keysight	WE_303: 为关键EMI信号更快检测而优化的实时测试设备(18) Volker Janssen, Rohde & Schwarz	WE_304: 802.11ax高效Wi-Fi简介(83) Alejandro Buritica, National Instruments	WE_305: 无线通信基础设施的高性能板材选型(126) Art Aguayo, Rogers Corp.

展览
开放
09:00
至
17:30

10:35-10:55	WE_401: 基于VNA的高速PCB快速精确测试(63) Yang Hongwen, Rohde & Schwarz	WE_402: 高级PA测试技术: 用于DPD、ET和测量加速的高级技术(85) Alejandro Buritica, National Instruments	WE_403: 用于下一代技术5G、物联网和车载电子的EMC解决方案(94) Sangam Baligar, AR RF/Microwave Instrumentation	WE_404: 用于5G仿真的软件定义无线电技术(77) Tom Higgins, Keysight	WE_405: 关于CMOS和SOI的射频模块(33) Malcolm Smith, AnalogSmith Design Solutions LLC
11:00-11:20	WE_501: 基于矢量网络分析仪的信号完整性测量(38) Fei Yu, Rohde & Schwarz	WE_502: 毫米波空中(OTA)测试挑战(89) Prasadh Ramachandran, Keysight	WE_503: EMC多频点抗干扰测试方案(69) Andy Zhang, hwa-tech Information System company	WE_504: 应用在移动终端设备上面的5G天线(113) Bin Yu, Speed Wireless Technology Co., Ltd	WE_505: 工作在180-190GHz的超高效高功率肖特基二极管倍频器(75) Michael Crowley, Farran Technology
11:25-11:45	WE_601: 400G以太网中PAM-4信号的挑战及测试方法(22) Li Kai, Keysight	WE_602: 射频前端器件和链路上的失真测量(121) Fabricio Dourado, Rohde & Schwarz	WE_603: 汽车电子的电磁兼容检测技术探讨(101) Cinya Tu, 远方仪器	WE_604: 利用OTA功率传感器进行波束赋形设备的校正(115) Frank-W. Thümmeler, Rohde & Schwarz	WE_605: 基于准垂直GaAs肖特基二极管改进谐波抑制的宽带微波倍频器(50) Nikolay Drobotun, TUSUR

12:00-13:00 午餐(展厅)

赞助商研习会

测量与建模 5G 射频与微波/物联网 射频与微波

13:00-13:40	WS_WE101: 下一代WLAN技术以及测试挑战和方案(95) Xiang Feng, Keysight	WS_WE102: 60GHz无线系统的场路协同仿真设计(64) ANSYS	WS_WE103: 窄带物联网: 运营模式和用例(134) Keysight	WS_WE104: 无线通信基础设施的高性能板材选型(151) Rogers Corporation	WS_WE105: e2v高可靠性半导体的核心设计解决方案(155) e2v
13:45-14:25	WS_WE201: 带有FSS次反射面的大型卡塞格伦天线仿真(46) ANSYS	WS_WE202: 适用于5G应用的20W全集成3.5 GHz GaN多尔蒂MMIC(132) Ampleon	PN_WE203: 座谈会: 移动基础设施的发展趋势(131) Moderator: Lerude	WS_WE204: 下一代汽车的新挑战(127) National Instruments	WS_WE205: 信号完整性和EMC的高级PCB规则检查(160) CST

14:30-14:50 茶歇(展厅)

射频与微波 测量与建模 5G

14:50-15:30	WS_WE301: 应用于商用基站的硅基氮化镓Doherty功率放大器设计(61) MACOM	WS_WE302: 针对高效射频功率放大器电路设计的实用测量方法以及非线性建模(47) Maury	WS_WE303: 用于5G MIMO信道仿真的宽带幅相控制矩阵(139) Mitron	WS_WE304: 用RAPID解决方案对Cardiff Model +的偏置和频率插值进行研究(152) Focus Microwaves	WS_WE305: RF GaN的未来展望: 应用和性能(150) Richardson RFPD
15:35-16:15	WS_WE401: PIN二极管的单片替代品——RF SOI功率限制器和开关(93) Peregrine Semiconductor	WS_WE402: 支持无线应用的多技术RF模块的设计流程和仿真技术(42) National Instruments	WS_WE403: 5G OTA测量(142) Rohde & Schwarz	WS_WE404: 射频和微波同轴开关: 如何用机电装置达到1000万次周期(145) Shanghai Radial Electronics Co. Ltd.	
16:20-17:00	WS_WE501: 应用于5G大规模MIMO的宽带、低功耗放大器(119) IDT	WS_WE502: 评测高频宽带宽器件射频性能的挑战(87) Keysight	WS_WE503: 解决4.5G PA和设备测量的测试挑战(148) National Instruments	WS_WE504: 新的场强探头和功率计在辐射抗扰度测试中的应用(154) Beijing Xutec	

2017年4月27日, 星期四

08:00-13:00 注册、报到

会议室305A 会议室305B 会议室307A 会议室307B

赞助商研习会

09:00-09:40	WS_TH101: 无线通信里的信号链创新解决方案(156) ADI	WS_TH102: 用于5G的革命性滤波器/IPD技术(140) MiniCircuits	WS_TH103: 一种适用于高频收/发MMIC芯片的高输出功率、低噪声系数硅基氮化镓工艺技术(162) OMMIC/四川益丰电子		
-------------	---------------------------------------	--	--	--	--

技术报告会

系统设计 高速数字设计 测试与测量 射频与微波

09:45-10:05	TH_101: WiGig: 802.11ad即将来临, 测试设备还未跟上, 这对我们意味着什么?(10) Wei Lin, National Instruments	TH_102: 高速串行总线无源通道建模及校准(12) Wu Jun, SHENZHEN EDADOC TECHNOLOGY CO.,LTD	TH_103: 50 GHz以上的相位噪声测量(120) Wolfgang Wendler, Rohde & Schwarz	TH_104: 面向大规模射频开关的智能型开关管理系统的设计与实现(118) Wang Qi, Pickering Instruments	展览 开放 09:00 至 13:00
10:10-10:30	TH_201: 尽量减少噪声系数测量中的不确定性(79) Wei Lin, National Instruments	TH_202: 电源完整性对DDR4/LPDDR4系统的影响(20) Jennie Grosslight, Keysight Technologies	TH_203: 用矢量网络分析仪进行探针表征的创新方法(105) Yuk Choi Andrew KO, Keysight	TH_204: 灵活运用于中端智能手机的射频解决方案(125) Mike Zhang, Qorvo	

10:30-10:50 茶歇(展厅)

测试与测量 雷达 射频与微波 射频与微波

10:50-11:10	TH_301: 时域脉冲波经线天线辐射的拖尾效应研究(17) Shi Pu, Wuhan University of Technology	TH_302: 汽车雷达目标仿真器(45) Tie Hieng Ling, Keysight	TH_303: 混合型实时负载牵引系统大反射条件下的系统精度验证(36) Xianfu SUN, Focus Microwaves	TH_304: 使用相控阵模型的5G通信系统仿真方法(67) Zhang Shuai, Keysight	
11:15-11:35	TH_401: 低频1/f噪声和随机电报噪声的在片测量与分析(26) Gu Feng, Keysight	TH_402: 复杂脉冲场景 - 当ARB的大小有限时, 如何用高采样率实现信号的长时间播放?(114) Frank-W. Thümmeler, Rohde & Schwarz	TH_403: DOCSIS 3.1部分频谱削波技术(107) Maxwell Huang(黄平), Cisco Systems	TH_404: 3D MIMO基站性能的新型实验室测试技巧(157) Yang Huaizhi, Keysight	
11:40-12:00	TH_501: 非线性参数测试的新方法(49) Zong Huiqing, Rohde & Schwarz	TH_502: 解决下一代ADAS车辆结构的测试挑战(84) Alejandro Buritica, National Instruments	TH_503: 毫米波应用的圆极化反足费米锥形槽天线(110) A. Sebak, Concordia Univeristy	TH_504: 利用软件架构搭建云测试平台(123) Shanshan Cong, Keysight	

张贴
论文
展示
(展厅)
14:00
至
15:00